

Fecha y hora:

Del 25 al 29 de Noviembre de 2013
Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.

Duración: 20 horas.

Objetivo:

- Conocer el concepto y tipos de Muestreo, así como sus ventajas y desventajas.
- Revisar los fundamentos de los diferentes planes de muestreo de aceptación más usados, basados en diferentes índices de calidad y, en su caso, poder hacer uso racional de los mismos en el trabajo diario.
- Elaborar Planes de Muestreo y determinar su curva de operación.



Beneficios:

- Conocer los distintos Sistemas de Muestreo más utilizados en la industria.
- El participante podrá tomar decisiones como: cual sistema de muestreo utilizar, que plan de muestreo implementar o que índice de calidad es el más adecuado para el caso.

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO



Registro: ACE-020716-RZ6-0013

Tels. 4737-0909 y 3330-6660
lourdes.gonzalez@aceconsultores.com

Dirigido a:

Personal responsable de calidad,
producción e inspección de recibo.

Metodología:

- Se llevará en forma de Taller, usando datos reales de su empresa.
- Se les asignarán tareas en base a la actividad de su área de trabajo.
- Se les aplicará un examen al final del curso para acreditar sus conocimientos

Al finalizar los participantes:

- ✓ Habrá utilizado la metodología para realizar el muestreo de aceptación para productos, procesos y materias primas.

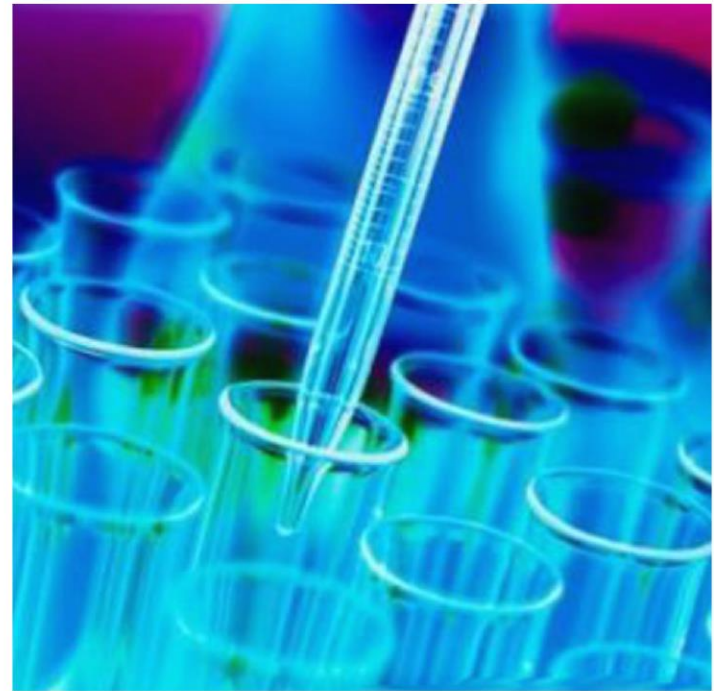


Temario:

1.- Introducción:

- Control de Aceptación.
- Ventajas del Muestreo de Aceptación.
- El Concepto de Muestreo.
- Tipos de Planes de Muestreo.
- Comparación de Planes por Atributos y por Variables.
- Responsabilidad de Asegurar la Calidad.
- Muestreo de Aceptación por Atributos Lote a Lote.
- Modelo de Muestreo de Aceptación de Lotes, por Atributos.
- Elaboración de un Plan de Muestreo Simple, por Atributos.

- Índices de Calidad para Planes de Muestreo de Aceptación.
- Factores que Afectan la Curva de Operación.
- Comparación de Curvas de Operación para Planes de Muestreo.
- Establecimiento de un Plan de Muestreo Sencillo, por Atributos, Lote a Lote.
- Tablas de Muestreo.





NOM

NOM-NNN-LLLL-NNNN

NOM-NNN-LLLL-NNNN

2.- NORMA OFICIAL MEXICANA Z-12/1983.

- Operación de los Planes de Muestreo de la NOM Z.12/1983
- Establecimiento de NCA's y NCR's.
- Problema de Aplicación.
- Tipos de Muestreo.
- Rutina para Decidir Sobre el Grado de Inspección.
- Tablas Principales de la NOM Z-12/1983

STPS



SECRETARÍA DEL TRABAJO
REGISTRO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Registro: ACE-020716-RZ6-0013

Costo: \$3,200.00 + 16% de I.V.A.

Incluye Material Didáctico y reconocimiento válido ante STPS.

3.- PLANES DE MUESTREO SENCILLOS, " c = 0 ", DE SQUEGLIA.

- Introducción.
- Problema de Aplicación
- Tablas Principales.

4.- DIAGRAMAS CHVV PARA MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR ATRIBUTOS.

- Razón de Ser.
- Diagrama para NOM Z/12/1983
- Problemas de Aplicación.
- Diagramas CHVV Y II.
- Problemas de Aplicación.



5.- TABLAS DODGE-ROMIG.

- Información General
- Tablas de Tolerancia de Lote, Muestreo Simple.
- Tablas de Tolerancia de Lote, Muestreo Doble.
- Tablas de Límite de Calidad, Promedio de Salida de Muestreo Simple.
- Tablas de Límite de Calidad, Promedio de Salida de Muestreo Doble.
- Problemas de Aplicación.



6.- MUESTREO DE ACEPTACIÓN Y FILOSOFÍA CERO DEFECTOS.

- Introducción.
- Producción de Corrida Grande.
- Producción de Corrida Corta.
- Curvas de Operación.
- Planes $c = 0$.
- Protección Contra el Desastre.
- Utilización de planes “ $c = 0$ ” en el Entorno Cero Defectos.
 - Nomograma CHVV III.
 - El Método del Intervalo de Confianza.
- Otros Enfoques.
- PPM Control.

STPS



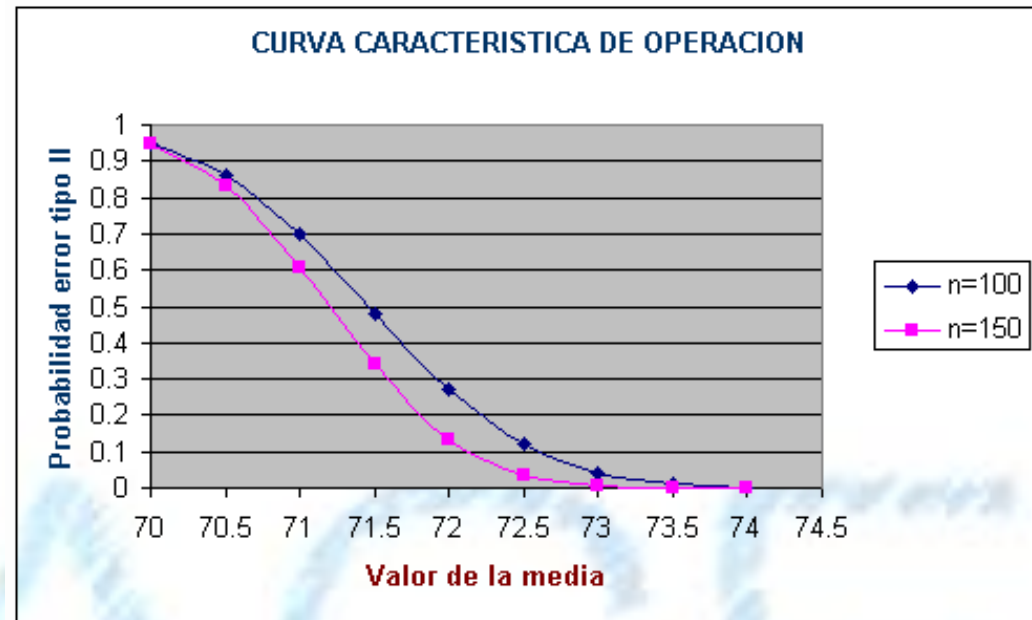
SECRETARÍA DEL TRABAJO
REGISTRO: ACE-020716-RZ6-0013

Costo: \$3,200.00 + 16% de I.V.A.

Incluye Material Didáctico y reconocimiento válido ante STPS.

7. NORMA MP 191/2. "PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO, TABLAS Y GRÁFICAS PARA INSPECCIÓN POR VARIABLES POR PORCIENTO DEFECTUOSO".

- Generalidades y Definiciones Adicionales.
- Conceptos Estadísticos Básicos.
- Descripción del NCA en Términos de Variables.
- Inspección por Muestreo.
- Método 'σ'.
- Método 's'.
- Nivel de Inspección.
- Curvas de Operación.
- Los Planes de Muestreo Estándar.
- Problemas de Aplicación.
- Tablas Principales.



8.- DISCUSIÓN DE PROBLEMAS DE LOS PARTICIPANTES.



MA. CLAUDIA VILCHIS BALDIT.

Licenciada en Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó estudios de post-grado en Alemania, obteniendo la especialidad en Protección Forestal, en la Universidad Técnica de Dresden y un diplomado en Consultoría y Administración Agrícola en el Instituto Witzenhausen de la Universidad de Kassel.

Desde 1999 obtuvo certificados como Auditor Líder en ISO 9000, ISO 14000 y BS 18000, ratificándolos en la actualidad en las últimas versiones de dichas normas. En éste mismo período trabajó en CHVV Consultores junto con su fundador el Ing. Carlos Hugo Vilchis Villaseñor, destacado especialista en Control Estadístico de Calidad en nuestro país y a nivel Internacional. Para ésta labor realizó varios diplomados en materia de Control Estadístico de la Producción, Buenas Prácticas de Manufactura, Análisis de Puntos Críticos de Control, Ingeniería y Sistemas Integrales de Calidad.


Durante la última década se ha dedicado a la asesoría, consultoría y capacitación en éstos temas. Trabajando como instructor de distintas instituciones tales como: Instituto Mexicano de Control de Calidad, el Instituto Mexicano de Profesionales del Empaque y el Embalaje, Sensor, Bureau Veritas, en cursos abiertos ó bien impartidos en plantas. Ha trabajado en empresas como: CFE, Danone, Sigma Alimentos, Laboratorios Merk, Farmacéutica Kendricks, ASOFARMA, Canifarma, Barcel, Concentrados Pepsico, Sabritas, con decenas de maquiladoras en el norte de nuestro país.



Contacto:

 www.asesoriaycapacitacionempresarial.mx

 capacitacion@aceconsultores.com

 33.30.66.60 o 47.37.09.09

 ACE.capacitacion

 Asesoriacapacitacionempresarial

Asesoría y Capacitación Empresarial en Productividad S.C.

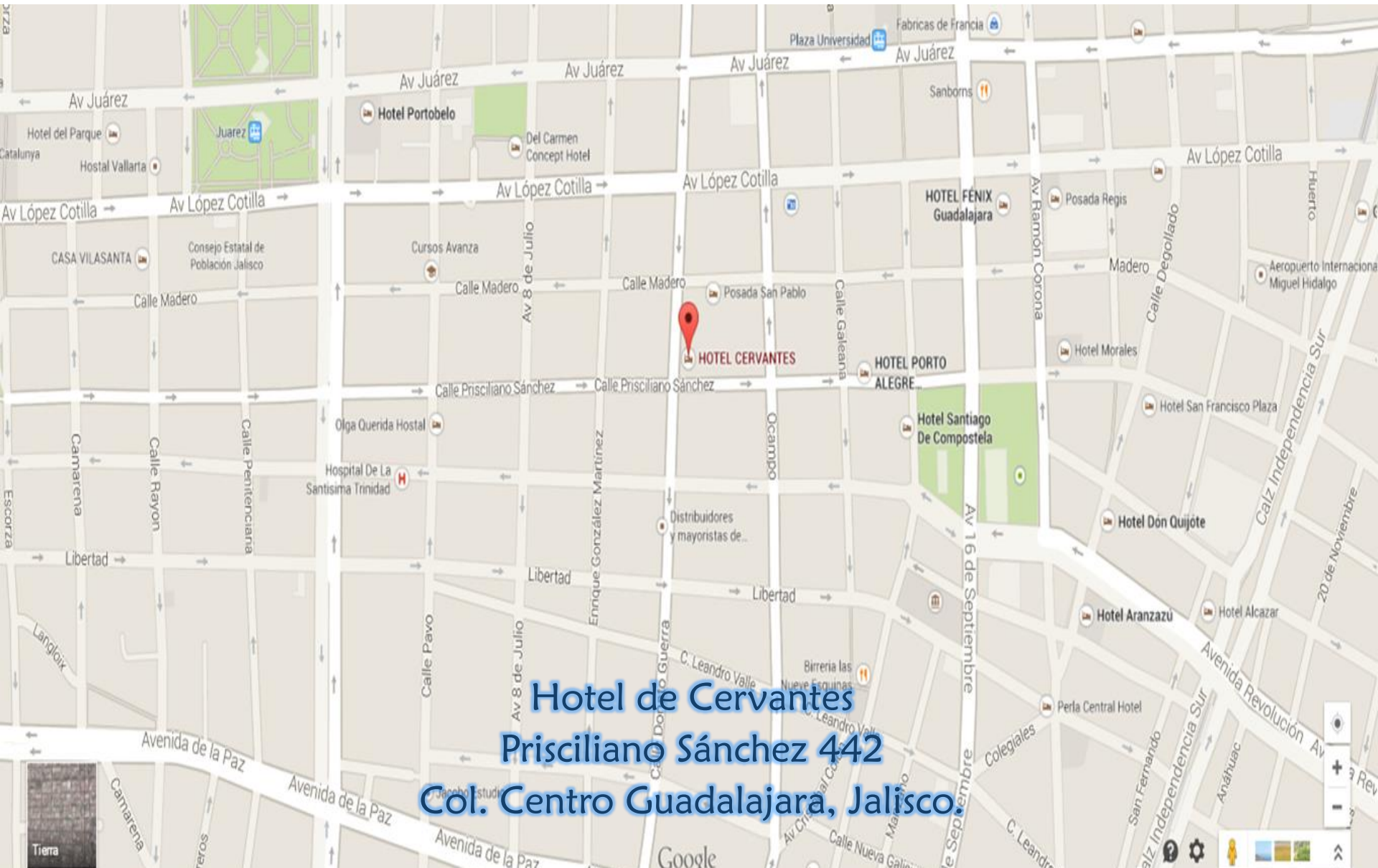
STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO



Registro: ACE-020716-RZ6-0013

Lugar del evento:



Hotel de Cervantes
Prisciliano Sánchez 442
Col. Centro Guadalajara, Jalisco